

电子元器件切片分析检测 百检网

产品名称	电子元器件切片分析检测 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展，从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有国际先进技术水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。百检网检测平台实行网络化管理，依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统，实现规范化运作，在*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术、质量**、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

1 氦质谱仪背压检漏方法 QJ 3212-2005 5.2 漏率

2 电工电子产品环境试验 GB/T2423.1-2008 第2部分：试验方法 试验A：低温 低温试验

3 电工电子产品环境试验 GB/T2423.1-2008 第2部分：试验方法 试验A：低温 低温试验

4 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 4.1.1 低温试验

- 5 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 4.1.1 低温试验
- 6 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 4.2.1 低温试验
- 7 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 4.2.1 低温试验
- 8 微电子试验方法和程序 GJB548B-2005 4.5.9.2 低温试验
- 9 微电子试验方法和程序 GJB548B-2005 4.5.9.2 低温试验
- 10 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 内部目检
- 11 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 制样镜检
- 12 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 剪切强度
- 13 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 可焊性
- 14 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006 声学扫描显微镜检查
- 15 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2066 外形尺寸